

- Anmeldungen** bis zum 08.03.2017 unter www.dgzfp.de/seminar/mthz
- Gebühren** Teilnahmegebühr 250,00 €
für Studenten (bis 30 Jahre) 50,00 €
inkl. Tagungsunterlagen und Pausenversorgung
- Stornierung** bis 22.02.2017: 50 % der Teilnahmegebühr
ab 23.02.2017: keine Erstattung möglich
- Überweisung** Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag nach Erhalt der Rechnung und vermerken Sie auf Ihrer Überweisung **unbedingt** die **Rechnungsnummer** und den **Namen des Teilnehmers**.
- Tagungsort** Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2 | 97082 Würzburg
www.isc.fraunhofer.de
- Organisation** Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V.
Max-Planck-Str. 6 | 12489 Berlin
Tel.: +49 30 67807-121/123
Fax: +49 30 67807-129
E-Mail: tagungen@dgzfp.de
- Sitzung am Rande** 06.04.2017
Sitzung des FA MTHz
- Hotel-reservierung** Hotelempfehlungen finden Sie auf der Tagungswebseite www.dgzfp.de/seminar/mthz
Bitte nehmen Sie die Reservierung selbst vor (Stichwort: DGZfP Seminar).



DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FÜR
ZERSTÖRUNGSFREIE
PRÜFUNG E.V.

unterstützt von:



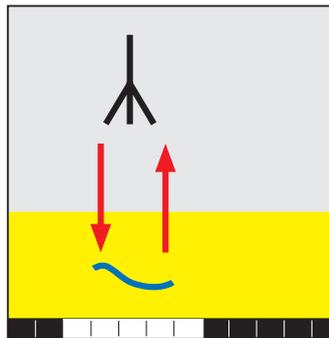
EINLADUNG PROGRAMM

3. Fachseminar

Mikrowellen- und Terahertz- Prüftechnik in der Praxis

mit den Schwerpunkten:

- Feuchtemessung in der Industrie
- Zerstörungsfreie Prüfung von Kunststoffbauteilen



5. April 2017, Würzburg

Industrieanwendungen, Technologien & Gerätevorführungen

Am 5. April 2017 findet auf Anregung des zuständigen Fachausschusses der DGZfP das „3. Fachseminar Mikrowellen- und Terahertz-Prüftechnik in der Praxis“ am Fraunhofer-Institut für Siliciumforschung ISC in Würzburg statt.

Die Veranstaltung gibt als eintägiges Kompaktseminar einen Überblick über den aktuellen Stand der Industrieanwendungen und Technologien und zeigt die Potentiale dieser Prüftechnik auf. Übersichtsvorträge zu den Prüftechniken werden durch zahlreiche Vorträge aus der Praxis ergänzt.

Wichtige Inhalte des Seminars sind:

- Mikrowellen- und Terahertz-basierte Feuchtemessung in der Industrie
- Zerstörungsfreie Prüfung von (glasfaserverstärkten) Kunststoffbauteilen
- Substratunabhängige Schichtdickenmessung
- Prozessmesstechnik für die Kunststoffindustrie
- Charakterisierung von Materialeigenschaften



Dr. Stefan Becker
Vorsitzender des
DGZfP-Fachausschusses
Mikrowellen- und
Terahertzverfahren



Dr.-Ing. Matthias Purschke
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der
DGZfP

10:00 Begrüßung

Moderation: S. Becker, Becker Photonik, Porta Westfalica

Vortragsblock 1

1 Einführung in die Mikrowellenprüftechnik

10:10 J.H. Hinken¹

¹ FI Test- und Messtechnik, Magdeburg

2 Einführung in die Terahertzprüftechnik

10:40 J. Jonuscheit¹

¹ Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern

Vortragsblock 2

11:10 Kurzpräsentationen der Aussteller

12:00 Mittagspause mit Gerätedemonstrationen

Vortragsblock 3

3 Feuchtemessung an planaren Materialien wie Papier und Pappe

13:00 A. Göller¹, B. Jungstand¹

¹ hf sensor, Leipzig

4 Mikrowellen-TS-Messung in wässrigen Flüssigkeiten

13:20 A. Göller¹, B. Jungstand¹

¹ hf sensor, Leipzig

5 Mikrowellen-Feuchtemessung für die Chemische Industrie

13:40 T. Collath¹, I. Brauer¹

¹ TEWS Elektronik, Hamburg

6 THz-Feuchtemessungen an Polyamiden

14:00 S. Kremling¹

¹ SKZ – Das Kunststoff-Zentrum, Würzburg

14:20 Pause

Vortragsblock 4

7 Direkt bildgebende Mikrowellenprüfung von WPC-Dielen

14:50 J.H. Hinken¹

¹ FI Test- und Messtechnik, Magdeburg

8 THz-SAFT Rekonstruktion von HDPE-Bauteilen

15:10 H. Spranger¹

¹ BAM, Berlin

9 Mikrowellenbasiertes Prozessmonitoring von Aushärtungsvorgängen bei der Herstellung von GFK-Bauteilen

15:30 J. Groh¹

¹ FAU Erlangen-Nürnberg, Erlangen

10 Inline-Produktionskontrolle bei der Herstellung von Pressmänteln mittels Terahertz-Messtechnik

15:50 J. Beck¹, U. Matuschczyk¹, E. Friederich², J. Jonuscheit²

¹ Voith Paper, Heidenheim; ² Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern

11 Berührungslose, zerstörungsfreie Prüfung von Radomen mittels Terahertz-Messtechnik

16:10 J. Bramble¹, N. Savage¹, F. Friederich², J. Jonuscheit²

¹ Meggitt Polymers & Composites, Stevenage, Großbritannien; ² Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern

16:30 Diskussion und Schlusswort